

2011 年 11 月 21 日

会社名 レーザーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡林 理
(コード番号 6920)
発表担当 企画 IR 室長 浅井 浩志
技術説明 技術一部長 関 寛和

新製品：透明ウェハ欠陥検査/レビュー装置
(英文用: Transparent Object Inspection System)
「WASAVI シリーズ TROIS33(トロワ)」を発表

【概要】

この度レーザーテックは、透明ウェハの検査・解析に特化した欠陥検査・レビュー装置「WASAVI シリーズ TROIS33」を製品化し、12 月より受注を開始いたします。

※ WASAVI : Wafer Surface Analyzing and Visualizing System

【説明】

レーザーテックは、明視野コンフォーカル光学系を用いて透明ウェハの各種欠陥をより高速に検出し、且つ高解像度で欠陥の観察が可能な透明ウェハ欠陥検査/レビュー装置”TROIS33”を製品化しました。

世界規模での省エネルギー意識が高まる中、エネルギー効率を極限まで高める新技術の必要性が高まっています。GaN(ガリウムナイトライド)や SiC(シリコンカーバイド)などの新材料を用いたパワーエレクトロニクスデバイスや高速通信用の次世代パワーデバイスの実用化技術もその一つであり、量産化に向けた研究開発が急速に進展しています。

当社は 2010 年に透明ウェハ欠陥検査/レビュー装置「TROIS32」を製品化しました。コンフォーカル光学系と微分干渉光学系の組合せによる高感度欠陥検査に加え、ヘテロエピ構造でも膜干渉の影響を受けない安定した検査を実現し、LED やパワーデバイスの研究開発用途で高い評価をいただいております。この度、より大口径のウェハを、より高速で検査したいというニーズにお応えして、新製品「TROIS33」を製品化しました。

TROIS33 は、TROIS32 の高感度欠陥検出、高解像度のレビュー機能、欠陥分類機能を継承し、ウェハの大口径化、量産化ニーズに対応する高速、且つ高感度の欠陥検査/レビュー装置です。最大 8 インチのウェハに対応し、10 分/枚(6 インチウェハ)という高速検査を実現しました。オートローダーや CIM 等の自動化にも対応し、量産工程での出荷・受入れ検査やプロセスモニタに適用できます。

レーザーテックは、お客様のニーズにいち早くお応えできる検査装置のご提供でお役に立ちたいと願っております。お問い合わせをお待ちしております。

(以上)

【用 途】

- ワイドバンドギャップ半導体、サファイア、石英など、透明ウェハの欠陥検査
- ワイドバンドギャップ半導体のエピタキシャル層（ホモエピ/ヘテロエピ）の欠陥検査
- エピタキシャル成長プロセス、装置の管理
- 研磨剤等の材料開発、研磨プロセスの管理
- 透明ウェハ上パターンの欠陥検査



TROIS33

【特 長】

- 透明ウェハの検査に最適なコンフォーカル光学系を採用し、裏面反射等の影響を受けない安定した検査が可能
- 微分干渉光学系により、シャロースクラッチや様々な結晶欠陥を高い感度で検出可能
- ブロードバンド光源と光学フィルタによる波長選択機能により、膜干渉などの影響を受けず、検査対象のウェハや膜に最適な条件での検査が可能
- 独自のアルゴリズムにより、欠陥以外の表面モフォロジの影響を受けない検査が可能
- 欠陥マップ表示機能、欠陥分類機能、マーキング機能を装備し、欠陥の分析をサポート

【仕様】

装置サイズ (mm)	※1,100 (W) × 1,050 (D) × 2,000 (H) (6 インチ仕様)
対応ウェハサイズ (インチ)	最大 φ 8 インチ対応可
検査対象ウェハ	GaN ほか各種透明ウェハ
検査時間	10 分/枚 (φ 6 インチ, 10x レンズ使用)

※オートローダー一部は含まれておりません。

【標準販売価格】

本体価格 1 億円～1.5 億円 (価格はモデル・仕様により異なります)

【受注・販売目標台数】

初年度 5 台

◇お問い合わせ先◇

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第二営業部: 神山 弦一郎

TEL: 045-478-7330 FAX: 045-478-7333 E-mail: sales@Lasertec.co.jp